

FE 式走査型電子顕微鏡

電子線を用いて測定対象物を拡大し、数mm～ナノレベルの形状を観察できる装置

【型式】

日本電子（株） JSM-7200F

【仕様】

倍率 : $\times 10 \sim \times 1,000,000$

加速電圧 : 0.01～30 kV

最大試料寸法 : $\phi 100 \text{ mm} \times 40 \text{ mm (t)}$ 以内

分析可能元素 : ${}^4\text{Be} \sim {}_{92}\text{U}$

検出器 : UED, LED, RBED (2次電子像, 反射電子像, 合成像)

その他機能 : GB 機能, Through The Lens 機能, 長焦点深度機能, 自動フォーカス,
自動非点収差調整, 自動色調調整

【設置年度】

2018 年度 (平成 30 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和4年9月9日